Laserová ablace se hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu – LA-ICP-MS







Laserová ablace

explozivní interakce
zaostřeného laserového záření
s povrchem pevného
materiálu

2 mechanismy – termický (odpařování) - < 10⁶ W/cm²

netermický (ablace)
> 10⁹ W/cm²





Laserová ablace



Laserová ablace

vznik mikroplazmatu – teplota až 15000 K – excitace a ionizace částic => zdroj záření (metoda LIBS)

tvorba částic – uvolnění atomů, iontů a fragmentů částic z povrchu – odnos tohoto materiálu do sekundárního ionizačního zdroje => ICP-MS/OES

> vznik kráteru

vzorkovací metoda pro LIBS a LA-ICP (vodivé i nevodivé materiály)



> tvorba mikroplazmatu

> snímání mikroplazmatu

> monochromatizace záření

> detekce záření

> záznam signálu



synchronizování Q-switch





tvorba ablatovaného materiálu

transport nosným plynem do ICP

➢ sekundární excitace a ionizace materiálu

➢ excitace → monochromatizace záření (mřížka) → detekce

➢ ionizace → separace částic dle m/z (MS analyzátory) → detekce





ICP



ICP

Excitační a ionizační mechanismy ICP

$Ar^{+} + X \rightarrow Ar + X^{+*} \pm \Delta E$	přenos náboje
$Ar^m + X \rightarrow Ar + X^{+*}$	Penningův efekt
$e^- + X \rightarrow e^- + e^- + X^+$	srážková ionizace
$e^{-} + X \rightarrow e^{-} + X^{*}$	srážková excitace

(X - atom analytu)

Ionizace v Ar ICP je určena první ionizační energií Ar (15,76 eV)

ICP



Ionizace v Ar ICP je v určována E_{i1}(Ar)=15.76 eV

> Kromě F, Ne a He mají všechny prvky E_{i1} < 16 eV \Rightarrow ICP produkuje ionty X⁺ pro všechny zájmové prvky

>87 prvků ze 103 má E_{i1}< 10 eV a tedy α > 50%

> 69 prvků ze 103 má E_{i1}< 8 eV a tedy α > 95 (90)%





ablační systémy

podle vlnové délky:

266 a 213 nm – Nd:YAG laser 193 nm – ArF laser 248 nm – KrF laser

➢ podle délky pulzy:

nanosekundové femtosekundové

ablační systémy

> ns Nd:YAG ablační systém

nejpoužívanější

CCD kamera pro snímání povrchu vzorku

ablační cela – různé velikosti a rozměry podle aplikace

xyz translátor – pohyb vzorku a možnost zaostřování paprsku během ablace



indukčně vázané plazma

➢ vf genrátor

plazmová hlavice

indukčně vázané plazma

➤ vf genrátor

dodává energii ICP výboji

frekvence generátoru ovlivňuje vlastnosti výboje (teplotu plazmatu, poměry intenzit atomových a iontových čar, poměry signálu k pozadí ...)

skládá se z:

zdroj stejnosměrného napětí

vf oscilátor

obvodu s indukční cívkou

indukčně vázané plazma

plazmová hlavice

soustava koncentricky uspořádaných křemenných trubic

ohraničuje plazmový výboj





- ➤ interface
- vakuový systém
- iontová optika
- ➤ analyzátory
- detektory

interface

dvoustupňový – sampler a skimmer (Ni nebo Pt)

nejnamáhanější součást ICP-MS spektrometru

oddělení hlavního toku Ar od toku atomů a iontů

oddělení atmosférického tlaku od vakua

sampler odebírá ionty z plazmatu







interface

tlak mezi kónusy 100 Pa => expanze plynu

nadzvuková expanze plynu za samplerem => prudké ochlazení

tvorba turbulencí – nežádoucí potlačení vhodnou polohou skimmeru (6-10 mm)







> vakuový systém

proč vakuum? málo částic => omezení počtu srážek v analyzátoru

rotační vývěva – interface (10² Pa)

turbomolekulární vývěva – iontová optika + analyzátor (10⁻⁶ - 10⁻⁴ Pa)

vysoké vakuum – rotační + turbomolekulární vývěvy



iontová optika

zaostření iontového svazku

akcelerace iontů před vstupem do analyzátoru

zabránění vstup nenabitých částic do analyzátoru – "photon stop"







> analyzátory

dělení iontů podle jejich m/z

statické analyzátory – k separaci iontů využívají separační pole (magnetické, elektrické nebo kombinaci obého) – parametry pole jsou časově konstantní

dynamické analyzátory – ionty s různou m/z mají rozdílnou rychlost a dobu letu analyzátorem (TOF)

 během separace iontů změna parametrů pole (q-MS)

> dynamické analyzátory



kvadrupólový filtr

time of flight (TOF)



kvadrupólový filtr

nejpoužívanější hmotnostní analyzátor pro ICP

4 elektrody kruhového průřezu (teoreticky parabolický průřez – Agilent)

filtrem prochází ionty jen o určitém m/z





kvadrupólový filtr

pohyb iontu v kvadrupólu je popsán Mathieuovými rovnicemi





kvadrupólový filtr

nízké rozlišení pro eliminaci spektrálních interferencí => použití kolizní reakční cely

spektrální interference – stejná hodnota m/z měřeného analytu i jiné částice (⁸⁷Sr a ⁸⁷Rb, ⁵⁶Fe a ¹⁶O⁴⁰Ar)

izobarické interference – 2 prvky mají stejné m/z

polyatomické ionty – v plazmatu dochází k tvorbě relativně stabilních molekul (ArH⁺, ArAr⁺, ArO⁺ …)

dvojnásobně nabité ionty – Rb++, Ce++ ...

kvadrupólový filtr

kolizně reakční cela

odstranění polyatomických interferentů

oktopól naplněný He, Ne, Ar, H₂, NH₃



eliminace interferentů diskriminací kinetickou energií – srážka s inertním plynem v okotpólu – ionty analytu mají nižší srážkový průřez než molekulové ionty

elimince interferentů iontově molekulovými reakcemi – chemická reakce mezi interferentem a pracovním plynem (H_2 , CH_4 ...), vzniká částice o jiném m/z

kvadrupólový filtr

kolizně reakční cela



➤ time of flight (TOF)

nejjednodušší hmotnostní analyzátor

"prázdná" letová trubice

separace iontů podle doby letu





$$t = d/U_d * \sqrt{(m/2ze)}$$
$$\bigvee_{t \sim (m/z)^{1/2}}$$

➤ time of flight (TOF)

repelling plate

ortogonální extrakce – ionty jsou extrahovány pulsním polem kolmám ke směru toku iontů – lepší rozlišení

> ion extraction detector (+) tube (L: length) **⊕ (+)**-(+)-(+) • **(+) ⊕** ⊕ acceleration zone (+)(U: acceleration voltage) **(+)** (+)(+ ⊕ (+)+ slit

➤ time of flight (TOF)

reflektor (reflektron) – iontové zrcadlo; "zaostření" iontů, aby na detektor dopadly současně – zlepšení rozlišení




➤ ICP-TOF (GBC)



statické analyzátory

elektrostatický sektor

magnetický sektor





U – energie iontu, E – intenzita elektrického pole

poloměr zakřivení je úměrný kinetické energii iontu a **nezávisí** na m/z => mononergetický svazek iontů dopadne na detektor současně

magnetický sektor (B, MAG)

separace iontů v magnetické poli dle ieiich m/z

 $m/z = B^2 r^2/2U$

změnou B

B – magnetická indukce

výběr vhodného m/z:

posun výstupní štěrbiny

změnou U (problém s nízkou extrakční účinností)

(+) = (+) = (+)

 $m_1/z_1 > m_2/z_2$

tandemové přístroje

kombinace elektrostatického a magnetického analzyátoru

EB tandem – ESA – výběr iontů s určitou kinetickou energií MAG – analýza m/z

Mattauch-Herzog geometrie – 31,8° ESA + 90°MAG, vhodné pro plošné detektory



tandemové přístroje

BE tandem – MAG – hmotnostní filtr ESA – analýza iontů dle kinetické energie

reverzní Nier-Johnson geometrie – 90° MAG + 90°ESA, vhodné pro skenovací spektrometry





přímý Nier-Johnson (EB) se používá v organické MS

detektory

elektronový násobič

channeltron

Faradayův pohár





- Faradayův pohár
- nízká citlivost

pro přesné měření iontů zejména v případě vysokých iontových proudů

součást tzv. multikolektorů



elektronový násobič

obdoba fotonásobiče z ICP-OES

série dynod s klesajícím potenciálem + kolektor elektronů

pokles potenciálu je diskrétní





➤ channeltron

trubice s polovodičovou vrstvou s kontinuálně klesajícím potenciálem (rozdíl proti elektronovému násobiči)





Příprava vzorků pro laserovou ablaci



Iaserová abalce vs. roztoková analýza

- příprava kompaktních materiálů
- příprava práškových materiálů
- ➢ problémy LA
- ➢ kalibrace

LA vs. roztoková analýza

LA-ICP-MS

- ✓ minimální příprava
 vzorku
- ✓ minimální kontaminace
- ✓ laterálního mapování
- ✓ hloubkové profilování
- v obtížná kvantifikace
 v nehomogenity vzorku
 v drahý laser

ICP-MS

- ✓ snadná kvantifikace✓ bulk analýza
- možná kontaminace
 časová náročnost
 rozkladu vzorku

obecný postup

- 2 zásadní informace:
- bulk nebo lokální analýza?

práškový nebo kompaktní vzorek

bulk analýza – homogenní vzorky

laterální mapování – nehomogenní vzorky

hábrus v pryskyřice – broušení a leštění povrchu

- výbrus na podložním sklíčku (typicky 30 um)
- > umístění do plastické hmoty

nábrus v pryskyřice

- zalití, broušení a leštění povrchu
- ✓ snadná manipulovatelnost
- ✓ rovný povrch vzorku
- ✓ standardní rozměry epoxy tablet



x zničení vzorku => nepoužitelné pro vzácné vzorky





výbrus na podložním sklíčku

- tloušťka výbrusů od X um do XXX um
- ✓ snadná manipulovatelnost
- ✓ rovný povrch vzorku
- zničení vzorku => nepoužitelné pro vzácné vzorky
 možnost "propálení" výbrusu





umístění v plastické hmotě

- pro vzácné vzorky
- ✓ snadná manipulovatelnost

* povrch vzorku není rovný => problémy se zaostřením záření



- ✓ bulk analýza
- × laterální mapování

- > mletí (mlýn)
- ≻homogenizace (mlýn)
- příprava kompaktních tablet (lisování, tavení, odlévání)

práškové vzorky

mletí a homogenizace

≻ mlýny

planetové

oscilační

nožové

diskové

hmoždířové

čelisťové











mletí a homogenizace

planetový mlýn

mletí středně tvrdých až tvrdých materiálů (keramika, křemen, kosti, půdy ...)

suché i mokré mletí

materiál mlýnu: WC, ZrO₂, achát, slinovaný Al₂O₃

rychlost otáček: 30-400 min-1

velikost částic: až 0,001 mm





mletí a homogenizace

oscilační mlýn

mletí středně tvrdých, měkkých, elastických i vláknitých materiálů (řasy, jehličí, kůra, dřevo)

suché, mokré mletí i kryogenní mletí (až -196°C)

materiál mlýnu: tvrzená ocel, nerezová ocel

frekvence vibrací: 3-25 Hz

velikost částic: až 0,005 mm





mletí a homogenizace

hmoždířový mlýn

mletí měkkých až středně tvrdých materiálů (drogy, farmaceutika, půdy, popel, potrava, soli ...)

suché i mokré mletí

materiál mlýnu: WC, ZrO₂, achát, slinovaný Al₂O₃

rychlost otáček: 100 min-1

velikost částic: < 0,010 mm





- lisování
- odlévání
- ➤ tavení
- ➤ sol-gel tablety



- lisování bez pojiva
 rychlost přípravy
 neředění vzorku
- malá soudržnost tablet
 vliv různé matrice vzorku

lisování s pojivem (celulóza, Ag, Al, teflon, grafit, PE, PVC …)

✓ jednotná matrice => potlačení matrix efektu
✓ pevné a soudržné tablety

- x nutnost homogenizace směsi vzorek-pojivo => prodloužení doby přípravy
- * ředění vzorku
- × možná kontaminace





- lisování
- hydraulické lisy tlak 5-100 MPa
- doba lisování vteřiny až minuty (v závislosti na lisovaném materiálu)
- velikost X mm X cm

použití pojiv: celulóza, práškové kovy, teflon, PE, PVC ...



odlévání

smíchání vzorku s pojivem (polyuretanová pryskyřice, epoxidová pryskyřice ...)

homogenizace ve vakuu (odstranění vzduchových bublin)

naplnění lukoprenových formiček (Ø 25 mm)

tuhnutí směsi

sol-gel technika

smíchání vzorku s tetraethoxy silanem => kapalná směs; 3 h ultrazvuk + 75°C; vznik gelu, vysušení a následné vylisování do formy tablet

možnost přidání porovnávacího prvku – dokonalá homogenizace oproti klasické přípravě tablet



zásadní problém ablačních metod – nedostatek kalibračních standardů

příprava vlastních kalibračních materiálů s vhodnou matricí

pro každý typ matrice nutný kalibrační materiál



matrix matched kalibrace

kalibrace s přizpůsobenou matricí – různý průběh ablačních dějů pro odlišné matrice

kalibrační standardy

certifikované referenční materiály – je jich nedostatek (pouze základní typy matric), drahé

příprava vlastních kalibračních materiálů – lisování ve formě tablet



matrix matched kalibrace

použití porovnávacího prvku – eliminace kolísání energie laseru a ablace různého množství materiálu (standard – vzorek)

práškové materiály – přidání prvku, který se nevyskytuje ve vzorku (Sc, Au, Ge, In …), přidání pevné látky nebo kapaliny pevná látka – homogenizace se vzorkem kapalina

kompaktní materiál – nemožnost přidání porovnávacího prvku => použití prvku z matrice vzorku – homogenní rozložení po celém vzorku, makrokomponenta. stanovení jeho obsahu jinou metodou (EPMA, XRF ...)



> normalizace na sumu signálů izotopů

měření všech možných prvků z matrice

I(Fe)abund = I(⁵⁶Fe)corr/zastoupení(⁵⁶Fe)

I(Li)abund, I(Na)abund, I(Ni)abund, I(Cr)abund, ... => \sum Iabund

obsah Fe = I(Fe)abund/∑labund *100 (%)

není potřeba kalibrační standardy použitelnost jen pro nekomplikované matrice



> dvojí vzorkování

zmlžování kapalného standardu

✓ snadná přístupnost kalibračních materiálů
 × odlišná odezva pro suchý a mokrý aerosol

přímá ablace kapalin

- ✓ obnovitelný povrch standardu
- × různá ablační účinnost kapalného a pevného vzorku

Aplikace

Aplikace LA-ICP-MS

- Laterální mapování
- Forenzní analýza
- Mapování biologických materiálů
- Studium předmětů kulturního dědictví
- ≻ "Bulk" analýza
- Využití v jaderném průmyslu

Laterální mapování

≻ EPMA vs. LA-ICP-MS

+ LA-ICP-MS	+ EPMA
minimální příprava vzorku	lepší laterální rozlišení
lepší detekční limity	zavedená metoda

➢ závislost LOD na velikosti ablačního kráteru (0,4 mg kg⁻¹Cu pro 127 µm; 18 mg kg⁻¹Cu pro 16 µm)¹
Laterální mapování

EPMA + LA-ICP-MS¹ – srovnání na Mg slitinách; kvantifikace –

$$I_{\rm corr}^{\rm isotope1} = I_{\rm signal}^{\rm isotope1} - I_{\rm blank}^{\rm isotope1}$$
(1)

In a next step, the corrected signals (I_{corr}) were abundance-corrected $(a_{isotope1})$ for each isotope to give the elemental intensities (Eq. (2)):

$$\frac{I_{\rm corr}^{\rm isotope1}}{a_{\rm isotope1}} \times 100 = I^{\rm element1}$$
(2)

Finally, the element intensities (I^{element1}) were normalized to the sum of all element intensities to give the concentration of each element (C^{element1}) in wt%:

$$\frac{I^{\text{element1}}}{\sum_{1}^{x} I^{\text{element}}} \times 100 = C^{\text{element1}}$$
(3)



¹ C. Latkoczy et al., Appl. Surf. Sci. (2005) 252: 127-132

normalizace signálu; LA vhodná pro nízké obsahy prvků (Fe, Co)

Comparison of quantitative results for main elements obtained by EPMA and LA-ICP-MS

	EPMA			LA-ICP-MS			
	Average \pm S.D.	Min	Max	Average \pm S.D.	Min	Max	
Mg	95.2 ± 2.5	82.2	97.5	93.1 ± 2.6	85.8	97.1	
Al	4.4 ± 2.3	2.3	15.6	5.6 ± 2.4	2.3	12.6	
Zn	0.34 ± 0.28	0.15	2.17	0.47 ± 0.22	0.17	1.19	

All values are given in wt%.



Forenzní analýza

srovnávání prvkového složení

srovnání izotopových poměrů

Iokální mikroanalýza

Forenzní analýza

Sledování intoxikace těžkými kovy¹ – vzorky vlasů sebevraha (otrava HgO) a pacienta léčeného cytostatiky (Pt)



Forenzní analýza

Otrávila svého tchána?¹ – rodenticid obsahující Tl; bulk analýza nehtu pomocí GF-AAS potvrdila otravu; LA-ICP-MS – normalizace signálu Tl na ³²S



¹S. Hann et al., Legal Medicine (2005) 119: 35-39

Studium předmětů kulturního dědictví

- ≻ Co to je?
- > Odkud to je?
- Jak je to staré?

➢ izotopové poměry Pb; ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb, ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb, ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb

Studium předmětů kulturního dědictví

Charakterizace starověkých a secesních skleněných předmětů¹ – 2 vzorky od Tiffanyho, 15 vzorků z Efesu (1.-7. stol. n.l.), charakterizace podle izotopových poměrů Pb



Studium předmětů kulturního dědictví

Konzervace písemností¹ – Fe, Cu, Mn (železoduběnkový inkoust) urychlují degradaci písemností – "*iron gall ink corrosion"*



Results of signal versus time registration for investigated samples before (white area) and after (grey area) the extraction by DTPA

Analýza celkového obsahu (bulk analýza)

➢ výhodné zejména pro těžkorozložitelné materiály (WC, ZrO keramika, …), pro analýzu vrstevnatých materiálů

použití laserového paprsku s velkým průměrem => potlačení nehomogenit vzorku

Analýza celkového obsahu (bulk analýza)

Těžko rozložitelné WC^{1,2} – příprava tablet s Ag pojivem, srovnání LA se zmlžováním roztoků, použití vnitřního standardu (Ge)

srovnání sintrovaných WC (kompaktní)
s práškovým WC; shoda ablací s XRF a
PN-ICP-OES analýzami

Analytical line (nm)	Nb II 316	5.340		Ta II 263.558				
Sample no./Type	Method	% m/m	% RSD	t bias (%rel)	% m/m	% RSD	t bias (%re	
554 S30/Cemented	XRF	1.55	3.0	2.263	3.93	2.2	0.544	
	LA-ICP-OES	1.46	2.1	-	3.81	3.8	-	
1060 U10/Cemented	XRF	1.45	3.3	0.264	3.75	3.1	1.732	
	LA-ICP-OES	1.44	1.6	_	3.57	2.5	-	
3152 S10/Binderless	PN-ICP-OES	3.10	1.0	2.966	8.00	1.0	0.358	
	LA-ICP-OES	2.97	1.8	-4.1	7.94	2.8	-	
4795 U10/Binderless	PN-ICP-OES	1.59	1.2	2.305	3.86	1.1	3.050	
	LA-ICP-OES	1.65	1.9	_	4.10	2.5	6.2	
3152 S10/Ag pellets	PN-ICP-OES	3.10	1.0	2.356	8.00	1.0	0.291	
	LA-ICP-OES	3.20	1.6	-	8.04	2.2	-	
4795 U10/Ag pellets	PN-ICP-OES	1.59	1.2	1.246	3.86	1.1	3.887	
	LA-ICP-OES	1.56	1.8	-	3.62	2.1	-6.3	

	Analytical line		Co II 228.616 nm					
	Calibrated range (% m/m)		3.09-22.69					
	Centroid (% mm)		10.05					
	Number of calibration samples (m)		13					
	Internal standard		-	Ge	W			
_	Slope (b)		1.39×103	0.137	3.93			
el)	Standard deviation of slope (s_b)		0.56×10 ²	1.4×10 ⁻³	6.2×10 ⁻²			
	Intercept (a)		2.8×10^{3}	(-0.055)	(1.04)			
	Standard deviation of intercept (s_{a})		6.2×10 ²	(0.037)	(1.63)			
	Calculated <i>t</i> -test value for $a(t_a)$		4.463	1.475	0.635			
	t-test critical value		2.026	2.026	2.026			
	Correlation coefficient (r)	<	0.9712	0.9892	0.9739			
	Uncertainty of centroid (% rel.)		±14.3	±8.9	±13.2			
	LDQ (% m/m)	<	1.0	0.06	0.09			

¹ M. Holá, et. al., ABC (2003) 377: 1165-1174 ² M. Holá, et al., Spectrochim B (2006) 61: 515-524

Analýza celkového obsahu (bulk analýza)

Stanovení Pb v kondenzátorech – pocínovaný Cu-drát (vrstva $\approx 100 \ \mu$ m); limit dle normy 700 μ g g⁻¹ Pb; srovnání výsledků LA-ICP-MS s PN-ICP-MS a EDXRF; navážka Sn vrstvy max. 1 mg !!!



obsah Pb [mg kg ⁻¹]							
XRF	LA-ICF	P-MS	PN-ICP-MS				
1020	1106	38	980	210			
750	770	70	880	140			
420	390	40	660	160			

důkaz kontaminace jaderným odpadem (²³⁵U/²³⁸U; ²³⁶U/²³⁸U)

> charakterizace jaderného paliva

využití při vývoji nových typů reaktorů (transmutory, SFR)

Transmutory – jaderné zařízení využívající vyhořelé jaderné palivo a jaderný odpad; chladící médium – tavená směs LiF-NaF; studium povrchu oceli "napadené" směsí LiF-NaF



Sodium-cooled fast reactor (SFR) – nový typ jaderných reaktorů; využití použitého paliva ze současných JE; studium interakce kapalný Na s CO₂

Charakterizace jaderného paliva¹ – stanovení izotopového složení (klasifikace odpadů); charakterizace pomocí HPLC-ICP-MS a LA-ICP-MS; laterální rozložení je značně nehomogenní => špatná použitelnost LA-ICP-MS



> Analýza inkluzí v jaderném palivu¹ – 20 % štěpných produktů jaderného paliva tvoří plyny (Xe a Kr), které narušují strukturu palivového článku; kalibrace – dávkovaní plynného Xe



Fig. 9 EPMA SEM picture (left) and a qualitative elemental composition of Xe of the same region of the fuel (right). Light grey shaded spots within the marked circles on the right side represent high Xe concentrations. They are in regions of fuel where unopened pores are assumed to be. The depth resolution of the EPMA is around 1–2 μm.



Fig. 4 Plot of the total amount of injected Xe atoms at two dilutions vs. measured signal. Regression coefficient: slope = $4.83 \times 10^{-9} \pm 0.4\%$, correlation = 0.99911; for the data values see Table 2.

¹ M. Horvath et al., JAAS (2007) 22: 1266-1274